

**«Утверждаю»  
Директор ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН**

**академик**

**Ю.В. Гуляев**

**20 декабря 2013 г.**

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**проверенных средств измерений и оборудования применяемых в методиках  
Нанотехнологического аналитического ЦКП ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН  
«Нанотехнология, наноматериалы, наноструктуры»**

1. Сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 H
2. Фотодетекторы ближнего ИК диапазона и дальнего ИК (терагерцового) диапазона для ИК Фурье-спектрометра Vertex 80v
3. Система управления Elphy Plus к электронному микроскопу Zeiss 1540 Elphy P1
4. Сверхвысоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп GPI-300
5. Сверхвысоковакуумная установка LT SPM LT SPM
6. Система микротравления ионным пучком SMI3050
7. Электронный микроскоп с системой электронной литографии eJne FBMS/ELPHY
8. Электронный микроскоп Zeiss 1540 EsB
9. Оборудование для спектроскопии в оптическом диапазоне длин волн — базовый оптический криостат Janis CCS-150
10. Векторный анализатор цепей MS4644A
11. Установка для анализа спектра SpectraPro 2500i
12. Сканирующий электронный микроскоп JSM-6460
13. Высоковакуумная универсальная установка магнетронного напыления многослойных тонкопленочных микроструктур Kurt Lesker
14. Зондовый микроскоп Multiprobe LT UHV STM
15. Установка вакуумного магнетронного напыления RJLC CMS IN LINE SPUTTER DEPOSITION SYSTEM

В результате проведения ежегодной проверки средств измерения и оборудования ЦКП ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН «Нанотехнология, наноматериалы, наноструктуры» установлено, что технические параметры проверенных средств измерения и оборудования соответствуют техническим параметрам фирм-изготовителей.

Руководитель ЦКП ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

(С.В. Зайцев-Зотов)